

Journée Thématique du réseau R&D semi-conducteurs - Effets des irradiations dans les détecteurs semi-conducteurs

ID de Contribution: 14

Type: Non spécifié

Dommages radiatifs dans les détecteurs HPGe

jeudi 16 juin 2016 14:30 (30 minutes)

Orateur: PIRARD, Benoît